اثر پارامترهای مختلف بر شدت جذب و نوار گاف بلور فوتونی پلاسمایی سهتایی با احتساب اثرات گرمایی و برخوردی پلاسما

زینب رحمانی*، ناهید رضایی دانشگاه کاشان، دانشکده فیزیک، گروه لیزر و فتونیک

دریافت: ۹۹/۵/۲۹ پذیرش: ۱۴۰۰/۶/۲۳

چکیدہ

در این مطالعه، انتشار امواج الکترومغناطیسی و ساختار نوار گاف در یک بلور فوتونی پلاسمایی یک بعدی سهتایی شامل پلاسمای برخوردی با در نظر گرفتن سرعت حرارتی الکترونها بررسی شده است. هر سلول واحد ساختار متشکل از لایههای دی الکتریک I_پلاسما_دی الکتریک I میباشد. پلاسما نوعی مادهٔ پاشنده است، یعنی ضریب شکست آن به فرکانس موج الکترومغناطیسی فرودی وابسته است. همین ویژگی، بلور فوتونی پلاسمایی را از سایر بلورهای فوتونی معمول متمایز می کند. در این مقاله با استفاده از روش ماتریس انتقال، شدت اختار متشکل از لایه این موج الکترومغناطیسی فرودی وابسته است. همین ویژگی، بلور فوتونی پلاسمایی را از سایر بلورهای فوتونی معمول متمایز می کند. در این مقاله با استفاده از روش ماتریس انتقال، شدت جذب و انعکاس امواج الکترومغناطیس با قطبش TT هنگامی که به طور عمود و مورب بر بلور فوتونی فرود می آید، مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج شبیه سازی نشان میدهند با تغییر پارامترهای مختلف بلور فوتونی مانند ضخامت و دمای الکترونی لایه پلاسما، ثابت دی الکتریک و ضخامت لایههای دی الکتریک، میتوان پهنا، تعداد و محل نورهای گاف را به صورت هدفمند تنظیم کرد و شدت جذب موج فرودی را کنترل کرد.

واژگان کلیدی: بلور فوتونی سهتایی، پلاسمای برخوردی، سرعت حرارتی الکترون، نوار گاف، جذب

مقدمه

بلور فوتونی را میتوان یک محیط با خواص اپتیکی متناوب تعریف کرد که پاشنده است و میزان گذردهی و انعکاس آن به شدت وابسته به طول موج فرود است. مهمترین اثر ناشی از تناوب، وجود بازههایی پیوسته و کراندار بسامدی است که در آنها امکان انتشار موج در ساختار وجود ندارد، به این نواحی گاف فوتونی یا نوار ممنوع بسامدی گفته میشود. معمولاً در طراحی هندسههای گوناگون بلورهای فوتونی، علاقمندیم ساختارهایی با عریض ترین پهنای نسبی گاف را به دست آوریم. دلیل علاقه به نوار گاف در بلورهای فوتونی، کاربردهای آن در زمینههای تحقیقاتی و فناوری مانند فیلترها، موجبرها، لیزرها، کلیدهای اپتیکی، کاواکها و… است [1–۵]. ساختارهای دارای نوار گاف فوتونی در فیبرهای نوری، سوییچها و عناصر فعال نوری که میتوانند جایگزین عناصر فعال الکترونیکی شوند، کاربردهای بسیاری دارند. یکی از جالبترین کاربردهای بلورهای فوتونی در ارتباطات فیبر نوری است. در این زمینه از ویژگی منحصر به فرد بلورهای فوتونی، یعنی انعکاس کامل نور هنگامی که فرکانس آن در محدودهٔ گاف فوتونی است، استفاده می شود و در نتیجه تلفات در غلاف فیبر و اثرات غیرخطی به طور چشمگیری کاهش مییابد. در ساخت موجبرهای نوری به عنوان یکی از مهمترین المانهای ادوات نوری، میتوان از بلورهای فوتونی به منظور کاهش بازتاب و تلفات موجبر در خمیدگیهای شدید و تزویج کاواکهای تشدید استفاده کرد. در سال ۲۰۰۴ هوجو و ماز بلور فوتونی پلاسمایی را پیشنهاد دادند [۷]. بسیاری از محققان خواص پراکندگی و خواص اپتیکی بلور فوتونی پلاسمایی یک بعدی را بررسی کردهاند. مهمترین ویژگی بلورهای فوتونی پلاسمایی، نوار گاف قابل تنظیم است که با پارامترهای پلاسما کنترل میشود [۷–۱۳]. در این تحقیق انتشار امواج الکترومغناطیس در یک بلور فوتونی پلاسمایی سهتایی با در نظر گرفتن برخورد و اثرات سرعت گرمایی الکترونهای پلاسما مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. همچنین ضرایب

تئوري و پيکربندي مسأله

ساختار مورد بررسی در کار حاضر همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است، شامل یک بلور فوتونی پلاسمایی یک بعدی سهتایی است که تحت تابش مایل موج الکترومغناطیسی با قطبش خطی قرار می گیرد. ضخامت لایههای دی الکتریک I، پلاسما و دی الکتریک II به ترتیب 1، 4 و 1 و 13 در نظر گرفته می شود و ثابتهای دی الکتریک لایه پلاسما و لایههای دی الکتریک II, I به ترتیب با ٤ و ٤ م مشخص می شوند.



شکل ۱: نمایی از فرود موج الکترومغناطیسی بر بلور فوتونی پلاسمایی یک بعدی سهتایی

لایهٔ پلاسما در بلور فوتونی مورد بررسی همگن و همسانگرد فرض میشود که با در نظر گرفتن اثرات برخورد و سرعت حرارتی الکترونها، ثابت دیالکتریک آن به صورت ذیل است[۱۴]:

پژوهشهای نوین فیزیک (نشریه علوم دانشگاه خوارزمی)

$$\varepsilon_{p} = \frac{\left[1 - \frac{\omega_{p}^{2}}{\omega(\omega - i\vartheta_{e})}\right]}{\left[1 + \frac{\omega_{p}^{2}\omega}{(\omega - i\vartheta_{e})^{3}\frac{T_{e}}{m_{e}c^{2}}}\right]}$$
(1)

در رابطه بالا ۵ فرکانس موج، C سرعت نور در خلاً، T_e دمای الکترون و g_e فرکانس برخورد الکترونها است. همچنین فرکانس پلاسما $^{1/2}_{2} = m_e = m_e n_e$ می باشد که $n_e = n_e n_e n_e n_e n_e n_e$ فرکانس پلاسما $^{1/2}_{2} = m_e n_e n_e n_e$ می باشد که $n_e = n_e n_e n_e n_e n_e n_e n_e$ معرّف چگالی تعداد الکترونها در پلاسما و جرم سکون الکترون است. با توجه به این که یونهای موجود در پلاسما، جرمی بسیار بزرگتر از الکترونها دارند که منجر به تحرک بسیار پایینتر آنها نسبت به الکترونها می شود، نمی توانند به امواج فرکانس بالای منتشر شده در پلاسما پاسخ دهند. بنابراین از اثر یونها در گذردهی دی الکتریک پلاسما چشم پوشی می شود و نقش آنها منتشر شده در پلاسما پاسخ دهند. بنابراین از اثر یونها در گذردهی دی الکتریک پلاسما چشم پوشی می شود و نقش آنها صرفاً فراهم نمودن شرط شبه خنشایی در پلاسماست. در این کار از روش ماتریس انتقال که شیوه ای شراخته شده در محاسبات و تحلیل ساختار باند، ضرایب انتقال و بازتاب طیف بلور فوتونی است، شناخته شده در محاسبات و تحلیل ساختار باند، ضرایب انتقال و بازتاب طیف بلور فوتونی است، است، است، است، استفاده می شود. ماتریس انتقال برای هر لایه ا

$$M_{j} = \begin{pmatrix} \cos \delta_{j} & -\frac{i}{\eta_{j}} \sin \delta_{j} \\ -i\eta_{j} \sin \delta_{j} & \cos \delta_{j} \end{pmatrix}, \quad j = A, B, C$$
(7)

که C,B,A به ترتیب مربوط به لایه دیالکتریک I، پلاسما و دیالکتریک II، است. δ_j ثابت فاز انتشار در لایه jام بصورت C,B,A به تراویه فرود موج θ ، تراوایی مغناطیسی و گذردهی الکتریکی ϵ_j, μ_j میباشد:

$$\delta_{j} = \frac{\omega}{C} \sqrt{\varepsilon_{j}} \sqrt{\mu_{j}} d_{j} \sqrt{1 - \sin^{2} \theta / \varepsilon_{j} \mu_{j}}$$
(r)

همچنین برای موج با قطبشTE امپدانس مشخصه، _۱، بصورت ذیل تعریف می شود:

$$\eta_j = \frac{\sqrt{\varepsilon_j}}{\sqrt{\mu_j}} \sqrt{1 - \sin^2 \theta / \varepsilon_j \mu_j} \tag{(f)}$$

$$\binom{E_n}{H_n} =$$
با استفاده از رابطهٔ میدانهای الکتریکی و مغناطیسی لایه n ام و (n+1) ام به وسیله ماتریس انتقال $M_n \binom{E_{n+1}}{H_{n+1}}$ ، می توان رابطه بین لایههای اول و آخر را بدست آورد:

$$\begin{pmatrix} E_1 \\ H_1 \end{pmatrix} = M \begin{pmatrix} E_{n+1} \\ H_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_{n+1} \\ H_{n+1} \end{pmatrix}$$
 (δ)

مستند. ضریب انعکاسr و ضریب عبور t با استفاده از عناصر $M=\prod_{j=1}^n M_j$ مستند. ضریب انعکاسr و ضریب عبور t با استفاده از عناصر ماتریس انتقال از طریق روابط زیر قابل محاسبه میباشد.

$$r = \frac{m_{11}\eta_0 + m_{12}\eta_0\eta_{n+1} - m_{21} + m_{22}\eta_0}{m_{11}m_{12}m$$

$$t = \frac{\frac{2\eta_0}{2\eta_0}}{m_{11}\eta_0 + m_{12}\eta_0\eta_{n+1} + m_{21} + m_{22}\eta_0} \tag{Y}$$

$$\eta_0 = \eta_{n+1} = \eta_0$$
 و η_{n+1} مربوط به محیطهای اول و آخر هستند که در این مطالعه خلاً در نظر گرفته شده و بنابراین $\eta_{n+1} = \eta_0$
 $\frac{\sqrt{\epsilon_0}}{\sqrt{\mu_0}} \sqrt{1 - (\sin^2 \theta / \epsilon_0 \mu_0)}$ است. در نهایت شدتهای عبور، انعکاس و جذب موج الکترومغناطیس با استفاده روابط
زیر تعیین می شوند.

$$R = |r|^2, \ T = |t|^2, \ A = 1 - R - T \tag{A}$$

در این بخش، نتایج حل عددی معادلهٔ (۸) برای انعکاس و جذب موج فرودی TE توسط یک بلور فوتونی پلاسمایی شامل پلاسمای برخوردی با در نظر گرفتن اثرات حرارتی الکترونها ارائه شده است. همچنین تأثیر پارامترهای مختلف بر نوارهای فوتونی بررسی شده است. پارامترها عبارتند از:

$$\epsilon_{
m d_1} = 2.1, \epsilon_{
m d_2} = 4.2$$
 , ${
m d_1} = {
m d_3} = 3mm$, ${
m d_2} = 0.8mm$, $\omega_{
m p} = 600 GHz$, $N = 10$

که فرکانس برخورد و انرژی جنبشی الکترونی بهنجار شده به ترتیب با عبارات $\frac{\vartheta_e}{\omega_p} = \vartheta$, $\vartheta = \frac{\tau_e}{mc^2}$ تعریف می شوند. لازم به ذکر است لایه های پلاسمای به کار رفته در ساختار حاضر در تقریب سرد یا غیرتعادلی در نظر گرفته شده و صرفاً اثرات دمای الکترونی و حرکات گرمایی آنها در پاشندگی انرژی موج فرودی و جذب موج بررسی می شود و این مسأله به هیچ عنوان مترادف با در نظر گرفتن پلاسمای گرم یا تعادلی (که در آن الکترون ها و یون ها هم دما هستند و معمولاً در رژیم آرک یا قوسی تخلیه الکتریکی رخ می دهد)، نمی باشد. در شکل۲، اثر دمای الکترونی بر شدت جذب و نوار گاف بلور فوتونی پلاسمایی نشان داده شده است. بر اساس دماهای جنبشی الکترونی پلاسما در رفرنس [۱۷–۱۴] منحنی های انعکاس و جذب در $\tau = 0, 0, 0, 0, 0, 0$ ترسیم شده است که به ترتیب با رنگهای قرمز، آبی و سبز مشخص میشوند. همان طور که مشهود است، با افزایش دما، تغییر قابل توجهی در نوار گاف مشاهده نمی شود، اما شدت جذب افزایش می یابد. افزایش سرعت حرارتی الکترون ها باعث برخوردهای تصادفی پی در پی بین ذرات در پلاسما شده و درنتیجه منجر به افزایش اثرات اتلافی می شود.



شکل۲. اثر دماهای متفاوت الکترونی لایههای پلاسما بر(a) انعکاس و (b) جذب درT = ۰٫۰۰۲ (قرمز)، ۰٫۰۰۵ (آبی)، ۰٫۰۱ (سبز)

تأثیر زاویهٔ فرود موج الکترومغناطیسی بر جذب و انعکاس در شکل ۳ بررسی شده است. شکلهای (۵)3، و (6)3 و (2)3 به ترتیب نمایانگر شدتهای انعکاس، جذب و عبور موج از بلور فوتونی هستند. در اینجا 0.03 $\theta = 0.005$ ، $\tau = 0.005$ و زوایای فرود عبارتند از $\theta = 0$ ، $\theta = 20^{\circ}$ ، $\theta = 0^{\circ}$. شکل (۵)۳ نشان می دهد که با افزایش زاویهٔ فرود به $\theta = 20^{\circ} = \theta$ ، پهنای نوار گاف و شدت قلههای جذب افزایش می یابد و به سمت فرکانسهای بالاتر جابهجا می شود.



شکل ۳. اثر زوایای فرود متفاوت بر (a) انعکاس، (b) جذب و (c) عبور برای heta = 0 (قرمز) ، $heta = 20^\circ$ (آبی) ، $heta = 50^\circ$ (سبز)

با مقایسهٔ منحنیهای رسم شده در شکل۴ میتوان اثر فاکتور اشغال (نسبت ضخامت پلاسما به ضخامت دیالکتریک) را برای پارامترهای0.03 = ϑ و 0.005 = τ مشاهده کرد. در شکل(۵)۴ نشان داده شده است که با افزایش ضخامت لایههای دیالکتریک از 3mm به 3mm و در نتیجه کاهش فاکتور اشغال، پهنای نوارهای گاف تقریباً کاهش و تعدادشان افزایش مییابد. علاوه بر این، ساختار نوار گاف با افزایش ضخامت لایههای دیالکتریک به سمت فرکانسهای پایین تر منتقل شده است. همان طور که در شکل (6)۴ مشاهده میشود، با کاهش فاکتور اشغال، شدت قلههای جذب کاهش در حالی که تعداد آنها افزایش مییابد.



شکل۴. اثر ضخامتهای مختلف لایه دیالکتریک بر(a) انعکاس و (b) جذب برای d₁ = d₃ = 3*mm* (قرمز)، (سبز) 4mm

در شکل (۵)۵ نشان داده شده است با تغییر ضخامت لایهٔ پلاسما از 0.8mm و 1mm و 2mm، پهنای نوارهای گاف افزایش می یابد اما تعداد آنها تغییر نمی *ک*ند. در توضیح این پدیده لازم است به پارامتر عمق پوسته یا عمق نفوذ در پلاسما اشاره کنیم. عمق نفوذ لایهٔ پلاسما (۵) یعنی طولی که طی آن دامنهٔ موج به 1/e مقدار اولیهاش تقلیل می یابد، تابع پارامترهای اشاره کنیم. عمق نفوذ لایهٔ پلاسما (δ) یعنی طولی که طی آن دامنهٔ موج به 1/e مقدار اولیهاش تقلیل می یابد، تابع پارامترهای پلاسما و فر کانس موج فرودی است و از بخش موهومی ثابت انتشار به صورت $\frac{-1}{\text{Im}(k)}$ به دست می آید. ثابت انتشار k در محیط پلاسمای همسانگرد با گذردهی دی الکتریک g از فرمول ذیل محاسبه می شود: (۹)

 $\vartheta_e = \frac{T_e}{m_e c^2}$ ، فركانس برخورد $\vartheta_e = \theta$ ، فركانس برخورد $\vartheta_e = \frac{T_e}{m_e c^2}$ ، فركانس برخورد $\vartheta_e = \theta$ ، فركانس برخورد $\vartheta_e = \theta$. فركانس برخورد $\vartheta_e = 0.03 \omega_p$ مىباشد و $\omega = 0.03 \omega_p$ به كار رفته در ساختار مورد نظر، عمق نفوذ موج فرودى با فركانس $\omega = 10$ Hz برابر $\omega = 0.83$ mm برابر و افزايش ω ، عمق نفوذ كاهش مىيابد. بنابراين با افزايش ضخامت لايههاى پلاسما به دليل چگالى بالاى آنها، موج در عبور از پلاسما با افت شديد دامنه مواجه مىشود و بنابراين انتشار موج از طريق بلور فوتونى سخت و پهناى باندهاى بازتاب

گستردهتر میشوند. همچنین در شکل (b) با افزایش ضخامت لایهٔ پلاسما، قلههای جذب به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده است که این امر ناشی از وجود پلاسمای برخوردی است و بنابراین با افزایش فاکتور اشغال، اثر جذب ناشی از اتلافات برخوردی و حرکت حرارتی الکترونی در پلاسما افزایش مییابد [۱۸–۱۹].



شكل۵. اثر ضخامت لايه پلاسما بر(a) انعكاس و (b) جذب برای d₂ = 0.8*mm* (قرمز)، 1mm (آبی)، 2mm (سبز)

 $\varepsilon_{d1} = 2.1$, $\varepsilon_{d2} = 4.2 = 4.2$ دیالکتریک دیالکتریک (a) و (b) و (b) منحنیهای انعکاس و جذب برای ثابتهای دیالکتریک $\varepsilon_{d2} = 4.2$, $\varepsilon_{d2} = 2.3$, $\varepsilon_{d1} = 4.2$, $\varepsilon_{d2} = 8.5$ مربوط به تفلون (Teflon)، و (b) و برای لایه ای از جنس شیشه (glass) ثابت دیالکتریک (b) و عام در $\varepsilon_{d1} = 4.2$ (glass) مربوط به دیالکتریک $\varepsilon_{d2} = 8.5$ مربوط به دیالکتریک $\varepsilon_{d1} = 4.2$, $\varepsilon_{d2} = 4.2$ (b) و برای لایه ای از جنس شیشه (glass) ثابت دیالکتریک (b) و در $\varepsilon_{d1} = 4.2$ (c) و برای لایه ای از جنس شیشه (glass) ثابت دیالکتریک (b) و برای لایه ای از جنس شیشه (glass) ثابت دیالکتریک (b) و برای لایه ای از جنس شیشه (glass) ثابت دیالکتریک (b) و برای لایه ای از جنس شیشه (glass) ثابت دیالکتریک (b) و برای لایه و او از گاف و از گاف و برای لایه و این (b) می می به نای نوار گاف و از گاف و افزایش ثابت دیالکتریک (c) و در نتیجه، ظاهر شدن نواحی و افزایش تعداد آنها می شود که دلیل آن اختلاف بیشتر بین گذردهی پلاسما و دیالکتریک و در نتیجه، ظاهر شدن نواحی عبور و انعکاس بیشتر است. علاوه بر این، ساختار نوار گاف با افزایش ضریب گذردهی لایهٔ دیالکتریک به سمت فرکانسهای و برای این داده شده این خار کردهی پلاسما و دیالکتریک و در نتیجه، ظاهر شدن نواحی عبور و انعکاس بیشتر است. علاوه بر این، ساختار نوار گاف با افزایش ضریب گذردهی لایهٔ دیالکتریک به سمت فرکانسهای و باین تعدیر می کند. همچنین در شکل (b) با افزایش ثابت دیالکتریک، شدت جذب افزایش می باد.



نتيجهگيرى

در این تحقیق، انتشار امواج الکترومغناطیسی قطبیدهٔ خطی در ساختار دورهای منظم (بلور فوتونی) بررسی شد. یک بلور فوتونی یک بعدی سه تایی شامل دو لایهٔ دی الکتریک متفاوت و لایهٔ پلاسمای برخوردی با اتلافات گرمایی، دارای آرایش دی الکتریک I-پلاسما-دی الکتریکII مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تأثیر پارامترهای موج فرودی مانند زاویهٔ فرود و فرکانس موج برای امواج TT بررسی شد. از طرف دیگر، تأثیر پارامترهای پلاسما و ساختار بلور فوتونی مانند دمای الکترونی، فرکانس پلاسما و ضخامت لایهٔ پلاسما، ثابت دی الکتریک و ضخامت لایههای دی الکتریک بر نوار گاف فوتونی و جذب تعیین شد. مشاهده شد که با افزایش دمای الکترون پلاسما، جذب افزایش می یابد. علاوه بر این، افزایش زاویه فرود باعث افزایش شد. مشاهده شد که با افزایش دمای الکترون پلاسما، جذب افزایش می یابد. علاوه بر این، افزایش زاویه فرود باعث افزایش کاهش یافته و قدرت جذب افزایش دمای الکترون پلاسما، جذب افزایش می یابد. علاوه بر این، افزایش زاویه فرود باعث افزایش کاهش یافته و قدرت جذب افزایش دمای میشود. نشان دادیم با افزایش ضخامت لایههای دی الکتریک، پهنای نوارهای گاف پهنای نوارهای گاف بدون تغییر در تعداد آنها، افزایش می یابند. سرانجام، تأثیر ثابت دی الکتریک لایههای دی الکتریک بر انعکاس و جذب بررسی شد. مطالعهٔ اثر پارامترهای مختلف بر شدت انعکاس و جذب در بلور فوتونی مورد نظر نشان داد که می توان با تغییر فاکتورهای مختلف، انعکاس و نوار گاف فوتونی را به صورت قابل کنترل تغییر داد.

منابع

- 1. L Ren, Y Li, N Li, C Chen Crystals 9 57 (2019)
- 2. M.R.J Azizpour, M Soroosh, N Dalvand, Y Seifi-Kavian Crystals. 9 461 (2019)

3. N.N Huang, Y.C Chung, H.T Chiu, J.C Hsu, Y.F Lin, C.T Kuo, Y.W Chang, C.Y Chen, T.R Lin, *Crystals*. 10 421 (2020)

4. A Y Herrera, J M Calero, N Porras-Montenegro Journal of Applied Physics. 123 033101 (2018)

5. H Francis, S Chen, K.J Che, M Hopkinson, C. Y Jin Crystals. 9 493 (2019)

6. H Hojo, A Mase J. Plasma Fusion Res. 80 89 (2004)

7. J Yao, et al AIP Advances. 9 065302 (2019)

8. H F Zhang, Y Ma, W Y Li, T Liu Physics of Plasmas. 26 012112 (2019)

9. H Tan, Ch Jin, L Zhuge, X Wu Physics of Plasmas. 26 052107 (2019)

10. H Tan, et al IEEE Transactions on Plasma Science. 46 539 (2018)

11. J Trieschmann, T Mussenbrock Journal of Applied Physics. 124 173302 (2018)

12. F Xue, et al Optical and Quantum Electronics. 49 19 (2017)

13. Z Rahmani, N Rezaee Optik. 184 134 (2019)

14. M R Jafari Milani, A R Niknam, A H Farahbod physics of plasmas. 21 063107 (2014)

15. H Wang, Y P Li Acta Phys. Sin. 50 2177-2178(2001)

16. X K Kong, S B Liu, H F Zhang, C Z Li, B R Bian J. Opt. 13 035101 (2011)

17. L Rajaei, S Mirabotalebi, B Shokri, Phys. Scr. 84 015506 (2011)

18. J D Joannopoulos, S G Johnson, J N Winn, R D. Meade, Photonic crystals: molding the flow of light, Second Edition, Princeton University Press (2008)

19. N A Krall and A W Trivelpiece, "Principles of Plasma Physics," McGraw-Hill, New York (1973)